

WO 2005/003744 A1

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出版

(19)世界知的所有権機関
国際事務局(43)国際公開日
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/003744 A1

(51)国際特許分類: G01N 21/78

(21)国際出版番号: PCT/JP2004/008711

(22)国際出版日: 2004年6月21日 (21.06.2004)

(25)国際出版の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:

特願2003-270797 2003年7月3日 (03.07.2003) JP

特願2004-106577 2004年3月31日 (31.03.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 和光純
粧工業株式会社 (WAKO PURE CHEMICAL INDUS-
TRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5408605 大阪府大阪市中央区
道修町三丁目1番2号 Osaka (JP).

(72)発明者; および

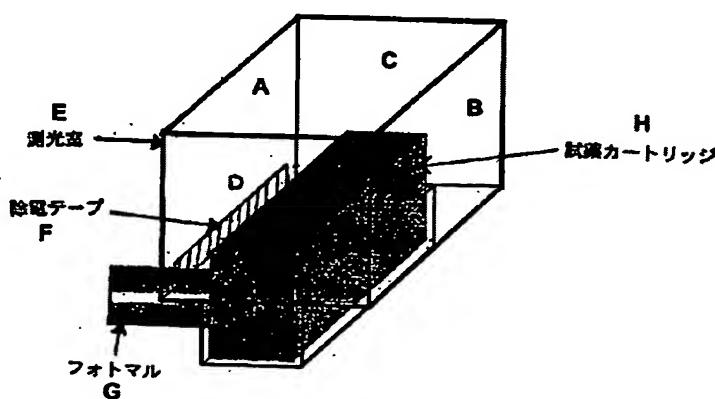
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 藤田 勝 (FUJITA, Takashi) [JP/JP]; 〒6610963 兵庫県尼崎市高田町6番1号 Hyogo (JP). 山本 幸子 (YAMAMOTO, Sachiko) [JP/JP]; 〒6610963 兵庫県尼崎市高田町6番1号 Hyogo (JP). 山田 浩之 (YAMADA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒6610963 兵庫県尼崎市高田町6番1号 Hyogo (JP). 赤羽 和 (AKAHANE, Wataru) [JP/JP]; 〒6610963 兵庫県尼崎市高田町6番1号 Hyogo (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

(総葉有)

(54) Title: SPECIFIC COMPONENT MEASURING METHOD BY SPECTRAL MEASUREMENT

(54)発明の名称: 分光測定による特定成分の測定方法



E...PHOTOMETRY CHAMBER

F...DESTATICIZING TAPE

G...PHOTOMULTIPLIER

H...REAGENT CARTRIDGE

(57) **Abstract:** A measuring method characterized by comprising the steps of measuring light produced by the energy variation of a substance caused by a specific component in a sample while preventing charges in an atmosphere in a photometry chamber from moving onto the surface of a solution on which the light is produced, and determining the amount of the specific component based on the measurement; and a device used for the method. The measuring method can solve such problems as day-to-day variations in signal value, and background becoming higher in measuring a specific component in a sample by using a spectral measurement device, and can measure a trace amount of a component with high accuracy and high sensitivity.

(57) **要約:** 試料中の特定成分に起因する物質のエネルギー変動により光を生じさせる溶液表面に、測光室内の界面上の電荷が移動することを防止して当該光を測定し、その測定値に基づ

(総葉有)

BEST AVAILABLE COPY